Proceedings of the 24th Linear Accelerator Meeting in Japan (July 7-9, 1999, Sapporo, Japan)

#### (P8-44)

# Improvement of Temporal Characteristics of Ultra High Speed Framing Camera for Measurement of LINAC Electron Beam

Yoshihiro ITO, Nobuhisa TONOMURA, Yasuto KATOH, Makoto KAGATA\*, Satoshi TOMIOKA and Takeaki ENOTO Division Quantum Energy and Engineering, Graduate School of Engineering, Hokkaido University Kita 13, Nishi 8, Kita-ku, Sapporo 060-8628, JAPAN \*Hokkaido Automotive Engineering College 1-2, Nakanoshima 2–6, Toyohira-ku, Sapporo 062-0922, JAPAN

#### Abstract

High speed camera is used for various measurements of LINAC. In this paper, by using the taper shape ETE (external transparent electrode), we propose a new time resolution improvement method of ultra high speed framing camera, consists of the proximity focused image intensifier and ETE. This method improves the simultaneity in the time in which the photoelectron arrived at MCP (micro channel plate)input plane. We decided ETE shape which made the acceleration electric field distribution that can keep the simultaneity. From computer simulation, the dispersion in the time of arrival of photoelectron was able to decreased from 30ps to 5ps or less.

### LINAC 電子ビーム測定における 超高速度フレーミングカメラの時間特性の改善

# 1 はじめに

LINAC において超高速度カメラは、パルスラジ オリシスの計測や、電子ビームモニタに用いられ、 フェムト秒ストリークカメラを用いた電子パルス 幅計測等が行われている。本研究室では、ビーム エミッタンス計測のために、バンチ形状等の空間 分布測定をシングルショットで行うX線超高速度 フレーミングカメラの研究を行っている。この外 部透明電極 (the external transparent electrode: 以下 ETE) を付加した近接型フレーミングカメ ラは、時間分解能に優れ、シャッタリング特性を 決定する ETE を容易に取り替えることが可能で あり、高い自由度を持つ。LINAC のビームモニ タとして可視光、及び X線フレーミングカメラ は様々な応用が考えられる。

本稿では、電子シャッター方式のフレーミング カメラにおけるシャッタリング原理上の問題につ いて述べ、その改善法を提案する。

現在、近接型超高速度フレーミングカメラは、 数 10ps の時間分解能を持つものが報告されてい る。これは、慣性核融合のターゲット計測、シン クロトロン放射光測定等の高速現象の計測に用い られている。ただし、数 10ps ~ 100ps の時間で は、シャッタリングパルスの伝搬時間に起因する 画像の同時性のずれが無視できなくなる。対策と して、画像取込部となる電極を縮小することが行 われているが、フレーミング方式の利点である空 間解像度が損なわれる。また従来は、画像各点で の同時性、及び MCP に到達する光電子の到達時 間の同時性が損なわれることについてはほとんど 言及されていない。

本稿では、シャッタリング用加速電界の時間・ 空間分布により、光電子の飛行時間を制御するこ とで、MCP に到達する光電子の到達時間の同時 性を高めることで時間分解能を改善することを目



図 1: ETE を付加した近接型高速度カメラ

的としている。

### 2 同時性改善

近接型光増幅素子を用いたフレーミングカメラ は、光電面、MCP(micro channel plate)、蛍光 面より構成され各々が極く近接した位置に置かれ ている。これにETE を付加し時間特性の改善を 行った[1]。図1に本カメラの構成を示す。ETE を付加することで、光電面はシャッタリング特性 を決定する要因ではなくなり、ETE の面抵抗、形 状によって、光電面下の加速電界分布の時間応答 特性が決定される。加速電界分布を空間各点の光 電子の同時性が保たれるように形成するETE の 形状をテーパ形状として最適化する。

2 次元の FD-TD 法 (finite-difference timedomain method)[2] を用いて、解析を行い加速電 界分布を求め、その分布での、光電子の飛行時間 分布を求めた。図2 に解析体系を示す。光電子は、 波長 600nm の入射光により単一速度で光電面か ら垂直に放出されるものとした。シャッタリング パルスは、-900V 、半値幅 100ps のガウシャン パルスを印加した。結果として、10mm 程度の電 極において、到達時刻のずれは5ps 以下に抑えら れることが得られた。図3、4 にシミュレーショ ンの結果を示す。

図3、4 において、横軸は光電面での電子の放出 時刻であり、縦軸は電子の飛行時間、及び電子の 放出位置をパラメータとしている。図3 は、ETE の形状を一様とした場合の結果である。図4 は、



ETE をテーパ形状にした場合である。印加した DC 逆バイアスは、それぞれ 540V、720V であ る。(逆バイアス値が異なるのは、テーパ形状で ない ETE の場合、720V の電圧を印加すると光 電子は MCP に到達できない理由による) 図の右 下に ETE の形状を示す。画像取込部 (MCP 入 力面の右側)から、それぞれ 2mm、4mm、6mm、 8mm、10mm の場所での結果を示した。図3 で は、シャッタリングパルスの伝搬時間にしたがっ て MCP 入力面への到達時刻が遅くなっていくこ とがみてとれる。この場合、到達時刻のずれは、 30ps 程度生じる。各ピークの横軸方向のずれは、 シャッタリングパルスの伝搬時間による。図4で は、加速電界分布により光電子の飛行時間が制御 され、到達時刻のずれは、ピークにおいて 5ps 以 下である。この結果より記録領域が 10mm 程度 であれば、5ps 程度まで同時性を改善できる。図 4の横軸方向のずれは(画像の同時性)は、光学系 を用いて補正可能である。また、本手法を積極的 に利用するとストリーク的にも使用可能である。

従来、30ps 程度生じていたずれが 5ps 以下に 軽減でき、MCP 入力面に同時に電子が入射する ことが可能となり、この時点で MCP の各チャン ネルにおいて同時にアバランシェ現象を起こすこ とで更なる時間分解能の向上がはかれる。また、 近接チェンネル同士の影響を軽減させることがで き、シャッタリング画像の質の向上をはかること が可能である。



図 3: 解析結果 (電界制御無し)



図 4: 解析結果 (電界制御有り)

## 3 今後の課題

### 3.1 ETE 形状の最適化

今回の ETE 形状は、反復計算から結果が良好 であったものであり、最適化がなされたものでは ない。特に、逆バイアス値が、シャッタリングパ ルスと比較して高いので、パルスの歪み等に影響 を受けやすい。決定するパラメータは、ETE の 位置と形状、逆バイアス値である。今後、上記の パラメータの最適化を行うアルゴリズムを組み込 み ETE 形状の決定を行う。

また、光電子の放出分布、速度分布への影響を 評価し空間解像度への影響を調べる。

#### 3.2 測定への応用

測定への応用として、冒頭で述べた X 線近接 型超高速度カメラによるビームバンチ形状の測定 を行っている。

可視光カメラの応用としては、電子ビームが空 気中等でチェレンコフ放射を生じることから、そ の放射分布を測定することが考えられる。本稿の カメラはフレーミング方式であるので、測定画像 は積分された画像となるが、これを逆問題的に処 理できれば電子ビームのマイクロパルス幅の推定 が行える可能性がある。

### 4 まとめ

本稿では、ETE を付加した超高速度フレーミ ングカメラのシャッタリング特性の改善手法を提 案し、数値シミュレーションにより有効性を示し た。従来では、30ps 程度生じた到達時刻のずれ を、5ps 以下に減少することができた。また、ETE 形状の最適化を行うことにより、さらに性能を向 上させることができると考える。

また、印加パルスが作る磁場効果を考慮し、 MCP をコリメータとして扱えば、磁場により曲 げられた光電子を入射角度でフィルタリングでき る。これにより時間分解能を向上させることが期 待でき、検討を行っている。

現在、本稿の手法を適用したカメラを試作して おり、チェレンコフ光を撮影する実験により検証 を行う予定である。

### 参考文献

- [1] 加賀田 誠, 富岡 智, 榎戸 武揚, "FD-TD 法 による超高速度カメラのシャッタリング特性 の解析", 電学論 A,117,22-28 (1997-1)
- [2] Gerrit Mur, "Absorbing Boundary Conditions for the Finite-Difference Approximation of the Time-Domain Electromagnetic-Field Equations", IEEE trans. Electromagnetic Compat., vol. EMC-23. No.4, pp.377-382 Nov.1981